

497413-2026 - Kompetizzjoni

Il-Ġermanja – Tagħmir tal-laboratorju, ottiku u ta' preċiżjoni (minbarra nuċċalijiet) – Dual Beam Focused Ion Beam System (FIB) und Transmissionselektronenmikroskop (TEM)

OJ S 136/2026 17/07/2026

Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Provvisti

1. Xerrej

1.1. Xerrej

Isem uffiċjali: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH

Email: wahl@ifos.uni-kl.de

Tip legali tax-xerrej: Organizzazzjoni li tagħti kuntratt issussidjat minn awtorità kontraenti

Attività tal-awtorità kontraenti: Edukazzjoni

2. Proċedura

2.1. Proċedura

Titlu: Dual Beam Focused Ion Beam System (FIB) und Transmissionselektronenmikroskop (TEM)

Deskrizzjoni: Los1: DualBeam Focused Ion Beam Systems (FIB) Gegenstand ist die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme sowie betriebsbereite Übergabe eines DualBeam Focused Ion Beam Systems (FIB) einschließlich Einweisung/Schulung und vollständiger Systemdokumentation. Die technischen Mindestanforderungen und Bewertungsaspekte ergeben sich aus den Dokumenten "Los1.25-1696.05.techn.Anforderungsprofil" und "Los1.25-1696.06.Wertungsmatrix". Los2: Transmissionselektronenmikroskop (TEM) Gegenstand ist die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme sowie betriebsbereite Übergabe eines Transmissionselektronenmikroskops (TEM) einschließlich Einweisung/Schulung und vollständiger Systemdokumentation. Die technischen Mindestanforderungen und Bewertungsaspekte ergeben sich aus den Dokumenten "Los2.25-1707.05.techn.Anforderungsprofil" und "Los2.25-1707.06.Wertungsmatrix".

Identifikatur tal-proċedura: b3e6743d-bfc2-4cac-a001-90b28790bddb

Identifikatur intern: 25-1696-1707

Tip ta' proċedura: Miftuħa

Il-proċedura hija aċċellerata: le

Elementi prinċipali tal-proċedura: Die Vergabe erfolgt in zwei Losen (Los 1: FIB, Los 2: TEM).

Bieter, die Angebote für beide Lose abgeben, können zusätzlich ein Gesamtangebot (Kombinationsangebot) einreichen. Das Kombinationsangebot muss auf den angebotenen Einzel-Angeboten zu beiden Losen basieren; der Leistungsumfang des Kombinationsangebotes muss den Leistungsumfängen der Angebote auf die Einzellöse entsprechen. Das Kombinationsangebot ist zusätzlich zu den losweisen Angeboten einzureichen und muss: - einen gesonderten Gesamtpreis für beide Lose (unter Berücksichtigung etwaiger Preisvorteile, z. B. Rabatte), sowie - eine Darstellung eines etwaigen losübergreifenden wissenschaftlichen, technischen, funktionalen oder organisatorischen Mehrwerts einer gemeinsamen Präparations- und Analytikplattform enthalten. Etwaige Preisvorteile werden ausschließlich im Zuschlagskriterium "Preis" berücksichtigt. Ein losübergreifender Mehrwert wird ausschließlich im Zuschlagskriterium "Technik" bewertet und setzt voraus, dass dieser über die Bewertung der Einzellöse

hinausgeht und sich aus dem Zusammenwirken beider Systeme ergibt. Die Bewertung der Kombinationsangebote erfolgt nach denselben Zuschlagskriterien. Zusätzlich werden losübergreifende Aspekte wie die vollständige wissenschaftliche Prozesskette einer Probe - von der Präparation im FIB über den qualitätserhaltenden Proben transfer und die korrelative Untersuchung im TEM bis hin zum gemeinsamen Datenmanagement und der nachvollziehbaren Dokumentation der Untersuchungsergebnisse berücksichtigt. Der Auftraggeber behält sich vor, den Zuschlag entweder losweise oder losübergreifend zu erteilen.

2.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Provvisti

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 38000000 Tagħmir tal-laboratorju, ottiku u ta' preċiżjoni (minbarra nuċċalijiet)

2.1.2. Post tal-prestazzjoni

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)

Pajjiż: Il-Ġermanja

2.1.4. Informazzjoni ġenerali

Informazzjoni addizzjonali: #Bekanntmachungs-ID: CXP4DNMMUBY#

Baži legali:

Direttiva 2014/24/UE

vgv -

2.1.5. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Numru massimu ta' lottijiet li għalihom offerent wieħed jista' jissottometti offerti: 2

Termini tal-kuntratt:

Numru massimu ta' lottijiet li għalihom jistgħu jingħataw kuntratti lil offerent wieħed: 2

2.1.6. Raġunijiet għall-esklużjoni

Sors tal-motivi għall-eżklużjoni: Avviż

Ksur tal-obbligi stabbiliti skont raġunijiet ta' esklużjoni purament nazzjonali:

Parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali:

Reati terroristiċi jew reati marbuta ma' attivitajiet terroristiċi:

Flus tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu:

Frodi:

Il-korruzzjoni:

Thaddim tat-tfal u forom oħra ta' traffikar tal-bnedmin:

Ksur tal-obbligu relatat mal-ħlas tat-taxxi:

Ksur tal-obbligu relatat mal-ħlas tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali:

Ksur tal-obbligi fl-oqsma tal-liġi ambjentali:

Ksur tal-obbligi fl-oqsma tal-liġi soċjali:

Ksur tal-obbligi fl-oqsma tal-liġi tax-xogħol:

Insolvenza:

Assijiet amministrati minn likwidatur:

L-attivitajiet kummerċjali huma sospizi:

Sitwazzjoni analoga bħal falliment skont il-liġi nazzjonali:

Imġiba professjonali serjament ħażina:

Ftehimiet ma' operatori ekonomiċi oħrajn li għandhom l-għan li jikkawżaw distorsjoni tal-kompetizzjoni:

Kunflitt ta' interess minħabba l-parteċipazzjoni tiegħu fil-proċedura ta' akkwist:

Involvement dirett jew indirett fit-tnejn ta' din il-proċedura ta' akkwist:
Terminazzjoni bikrija, danni jew sanzjonijiet komparabbli oħra:
Dikjarazzjoni falza, informazzjoni moħbija, ma setgħux jiġu pprovduti d-dokumenti meħtieġa
jew inkisbet informazzjoni kunfidenzjali ta' din il-proċedura:

5. Lott

5.1. Lott: LOT-0001

Titlu: Dual Beam Focused Ion Beam System (FIB)

Deskrizzjoni: Ziel dieses Beschaffungsvorhabens ist die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme sowie betriebsbereite Übergabe eines Dual-Beam-FIB/REM-Systems (Focused Ion Beam / Rasterelektronenmikroskop) einschließlich analytischer Detektorsysteme, Schulung und vollständiger Systemdokumentation. Das System dient primär der präzisen Probenpräparation (u.a. TEM-Lamellen, APT-Spitzen, Querschnitte und Defektfreilegungen) und sekundär der hochauflösenden bildgebenden, chemischen und strukturellen Charakterisierung (SEM, EDX, STEM, EBSD) im selben System. Das Gerät wird als zentrale Präparations- und Analyseplattform für wissenschaftliche Forschungsprojekte eingesetzt. Typische Anwendungen umfassen u. a. Batterie- und Elektrodenmaterialien, Wasserstoffspeichermaterialien, katalytische Schichten, Metalle/Legierungen, keramische Werkstoffe, Halbleiter, Beschichtungen und Multilayer-Systeme. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf: - reproduzierbarer, möglichst automatisierter TEM-Lamellen- und APT-Präparation (Lift-Out, Thinning, Polishing) - 3D-Analytik (Serienschliff/Tomographie) mit quantitativer Auswertung - hochaufgelöster Abbildung in verschiedenen SEM-Modi incl. Ioneninduzierter Sekundärionen sowie korrelierter Bildgebung während der Bearbeitung - chemischer Analytik mittels EDX und kristallographischer Analytik mittels EBSD Darüber hinaus ist eine strukturierte Erfassung und Exportfähigkeit von Messdaten und Metadaten in gängige, nicht-proprietäre Formate erforderlich, um Anforderungen an Nachvollziehbarkeit, Langzeitverfügbarkeit und Forschungsdatenmanagement (FAIR-Prinzipien) zu erfüllen. Das System muss die präzise Probenpräparation und -strukturierung mittels Ionenstrahl sowie die begleitende und nachfolgende Abbildung und Analytik mittels SEM und anderen Detektorsystemen ermöglichen. Ziel ist die reproduzierbare Präparation von Proben für TEM und APT sowie die Durchführung von 2D/3D-Analysen (Bildgebung (SE, STEM), EDX, EBSD) einschließlich vollständiger Dokumentation der Bearbeitungs- und Messparameter. Folgende Kernfunktionen sind zwingend bereitzustellen: 1. Materialabtrag/Strukturierung (manuell und automatisiert) mit definierbaren Pattern- und Rezeptfunktionen. 2. TEM-Lamellenpräparation inkl. In-situ Lift-Out, Thinning und abschließender Feinpolitur. 3. APT-Spitzenpräparation (Needle Milling) inkl. reproduzierbarer Geometrie. 4. Korrelierte Echtzeit-Bildgebung im SEM während der FIB-Bearbeitung (Navigation/Endpunktkontrolle). 5. Chemische Analytik mittels EDX sowie kristallographische Analytik mittels EBSD (Punkt, Linie, Mapping). 6. 3D-Workflows (Serienschliff/Tomographie) mit dokumentierter Rekonstruktion bzw. Export der Datensätze. 7. Workflow und Datenmanagement: eindeutige Zuordnung von Bearbeitungs-/Messdaten, Parametern und Metadaten; Export in nicht proprietäre Formate.

Identifikatur intern: 1

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Provvisti

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 38000000 Tagħmir tal-laboratorju, ottiku u ta' preċiżjoni (minbarra nuċċalijiet)

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Tul ta' żmien ieħor: Mhux magħruf

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: Ma hemmx għalfejn tingħata

Proġett ta' akkwist iffinanzjat kompletament jew parzjalment mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): Ie

Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħira u ta' daqs medju (SMEs): Ie

5.1.7. Akkwist strateġiku

Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż

Kriterju: Referenzi fuq consegne speċifiċi

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Eignungskriterium ist die Vorlage von 3 Referenzen zu vergleichbaren Installationen. Bei Angeboten für ein Los sind Referenzen für vergleichbare Systeme des jeweiligen Loses vorzulegen. Bei Angeboten für beide Lose können Referenzen für beide Systemtypen oder vergleichbare integrierte Systeme eingereicht werden. Als vergleichbare Referenzen gelten erfolgreich durchgeführte Liefer-, Installations- und Inbetriebnahmeprojekte von Systemen, die in Art, Funktion und Komplexität dem jeweils angebotenen Los entsprechen (Los 1: DualBeam FIB bzw. vergleichbare FIB/SEM-Systeme; Los 2: TEM bzw. vergleichbare Elektronenmikroskope). Die Referenzen müssen den vollständigen Leistungsumfang (Lieferung, Installation, Inbetriebnahme, betriebsbereite Übergabe sowie Einweisung) umfassen und in einem wissenschaftlichen oder industriellen High-Tech-Umfeld erbracht worden sein. Sie dürfen zum Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsfrist nicht älter als drei Jahre sein.

5.1.10. Kriterji tal-għoti

Kriterju:

Tip: Prezz

Isem: Preis (Angebote auf Einzellose und Kombinationsangebote)

Deskrizzjoni: Für das Zuschlagskriterium Preis erhält das Angebot mit dem niedrigsten (gewerteten) Preis 5 Punkte. Null Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem Doppelten des niedrigsten (gewerteten) Angebotspreises. Alle Angebote mit einem Angebotspreis über dem Doppelten des niedrigsten (gewerteten) Angebotspreises erhalten ebenfalls null Punkte. Die Punktebewertung für die dazwischenliegenden Angebotspreise erfolgt über eine lineare Interpunktion mit 4 Stellen hinter dem Komma.

Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta' ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)

Numru tal-kriterju għall-għoti: 50

Kriterju:

Tip: Kwalità

Isem: Technik (Angebote auf Einzellose bzw. Kombinationsangebote)

Deskrizzjoni: Für das Zuschlagskriterium Technik werden ausschließlich die nachgewiesenen technischen Leistungsparameter von im Dokument 06.Wertungsmatrix Abschnitt 2 (technische Übererfüllung (wertungsrelevant)) des jeweiligen Loses genannten Anforderungen bewertet.

Das Zuschlagskriterium Technik wird ermittelt, indem die Wertungspunkte der einzelnen Anforderungen jeweils mit dem festgelegten Gewichtungsfaktor gemäß Dokument "06. Wertungsmatrix", Abschnitt 2 ("technische Übererfüllung (wertungsrelevant)") des jeweiligen Loses, multipliziert und anschließend aufsummiert werden. Die technische Bewertung eines Kombinationsangebotes setzt sich aus der technischen Bewertung der beiden Einzellose sowie der Bewertung des zusätzlichen wissenschaftlichen und funktionalen Mehrwerts der gemeinsamen Präparations- und Analytikplattform zusammen. Unterkriterien für diesen Mehrwert sind: K1 durchgängiger Probenworkflow zwischen FIB und TEM K2 Qualität des Probentransfers K3 korrelative Wiederauffindbarkeit identischer Probenbereiche K4 gemeinsames Daten- und Projektmanagement K5 gemeinsames Service- und Betriebskonzept Ergänzend wird auf das Dokument "Gesamt.06.Wertungsmatrix.pdf." Kategorija tal-kriterju tal-ghoti piż: Fattur ta' ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt) Numru tal-kriterju għall-ghoti: 50

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż
Skadenza biex tintalab informazzjoni addizzjonali: 10/08/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali
Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.dtyp.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY/documents>

Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:

URL: <https://www.dtyp.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY>

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.dtyp.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partecipazzjoni: Ġermaniż

Katalogu elektroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Permissa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 17/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 77 Jiem

Informazzjoni li tista' tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni:

Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerenti jistgħu jiġu pprezentati aktar tard.

Informazzjoni addizzjonali: Die Vergabestelle behält sich vor, fehlende Angaben und Erklärungen nachzufordern. Ein Anspruch der Bieter besteht nicht (§ 56 VgV). Angebote, die nicht die geforderten oder gegebenenfalls nachgeforderten Erklärungen und Nachweise enthalten, werden nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 VgV ausgeschlossen.

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjegi protetti: Le

Fatturazzjoni elettronika: Permissa

Se tintuża l-ordni elettronika: Ie

Se jintuża l-pagament elettroniku: Ie

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

5.1.16. **Aktar informazzjoni, medjazzjoni u riežami**

Organizzazzjoni tar-riežami: Vergabekammer Rheinland-Pfalz, c/o Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima

Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-riežami: Die Vergabekammer leitet ein

Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. Der Antrag ist unzulässig, soweit - der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen

Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberührt, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt.

Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH

Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-parteeċipazzjoni: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH

5.1. **Lott: LOT-0002**

Titlu: Transmissionselektronenmikroskop (TEM)

Deskrizzjoni: Gegenstand des Beschaffungsvorhabens ist die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme sowie betriebsbereite Übergabe eines aberrationskorrigierten 200 kV Transmissionselektronenmikroskops (S/TEM) einschließlich analytischer Detektorsysteme, Schulung und vollständiger Systemdokumentation. Das System dient als zentrale Analyseplattform für die hochauflösende strukturelle, chemische und elektronische Charakterisierung von Materialien auf atomarer und nanometergenauer Skala. Es wird sowohl für industrielle Auftragsanalytik als auch für wissenschaftliche Forschungsprojekte eingesetzt. Im Institut werden Materialien mit stark variierenden Eigenschaften untersucht, insbesondere Metalle, Legierungen, keramische Werkstoffe, Halbleiter, Beschichtungen, funktionale Schichtsysteme sowie nanostrukturierte Materialien. Die Proben unterscheiden sich hinsichtlich Geometrie, Stabilität gegenüber Elektronenstrahlbelastung sowie analytischer Fragestellungen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf: - hochauflösender Abbildung bis in den atomaren Bereich - chemischer Analytik mittels EDX und EELS - Untersuchung von Grenzflächen und Defekten - Untersuchung magnetischer und funktionaler Materialien - reproduzierbaren Messungen über Probenserien hinweg Darüber hinaus ist eine strukturierte Erfassung und Exportfähigkeit von Messdaten und Metadaten in gängige, nicht-proprietäre Formate erforderlich, um Anforderungen an Nachvollziehbarkeit, Langzeitverfügbarkeit und Forschungsdatenmanagement (FAIR-Prinzipien) zu erfüllen. Das System muss die hochauflösende strukturelle, chemische und elektronische Analyse von festen, elektronenstrahlstabilen Proben im Transmissionselektronenmikroskopie- und Raster-

Transmissionselektronenmikroskopie-Modus ermöglichen. Hierzu muss es eine präzise Elektronenoptik, stabile Betriebsbedingungen sowie integrierte analytische Detektionssysteme bereitstellen. Ziel ist die Untersuchung von Materialien bis in den atomaren Maßstab sowie die quantitative und qualitative Analyse von Struktur, Zusammensetzung und elektronischen Eigenschaften. Folgende Kernfunktionen sind zwingend bereitzustellen: 1. Hochauflösende Abbildung (TEM und STEM): - Abbildung von Kristallstrukturen, Defekten, Grenzflächen und Nanostrukturen mit atomarer bzw. sub-nanometergenauer Auflösung. - Betrieb sowohl im konventionellen TEM- als auch im STEM-Modus. - Flexible Wahl geeigneter Abbildungsmodi (z. B. Bright Field, Dark Field, HAADF, ABF, Oberflächenbildgebung mit topografieabhängigem Kontrast). 2. Chemische und spektroskopische Analytik: - Elementanalytik mittels energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDX). - Analyse elektronischer und chemischer Zustände mittels Elektronenenergieverlustspektroskopie (EELS). - Durchführung von Punktanalysen, Linienprofilen sowie zweidimensionalem Mapping. 3. Untersuchung von Grenzflächen und Defekten: - Analyse von Phasengrenzen, Ausscheidungen, Korngrenzen und strukturellen Inhomogenitäten. - Untersuchung lokaler chemischer Variationen auf nanoskaliger Ebene. 4. Untersuchung funktionaler und magnetischer Materialien: - Möglichkeit zur magnetfeldfreien oder feldarmen Abbildung (z. B. Lorentz-Modus oder funktional gleichwertig), soweit erforderlich. 5. Automatisierter und reproduzierbarer Betrieb: - Reproduzierbare Einstellung von Messparametern und Speicherung von Messabläufen. - Unterstützung automatisierter Messreihen und Mapping-Experimente. 6. Workflow und Datenmanagement: - Eindeutige Zuordnung von Messdaten, Parametern und Metadaten. - Möglichkeit zur späteren Reproduktion von Messbedingungen. 7. Integration aller Detektoren und Betriebsmodi in eine konsistente Bedienumgebung.

Identifikatur intern: 2

5.1.1. **Għan**

Natura tal-kuntratt: Provvisti

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 38000000 Tagħmir tal-laboratorju, ottiku u ta' preċiżjoni (minbarra nuċċalijiet)

5.1.2. **Post tal-prestazzjoni**

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)

Pajjiż: Il-Ġermanja

5.1.3. **Tul ta' żmien stmat**

Tul ta' żmien ieħor: Mhux magħruf

5.1.6. **Informazzjoni ġenerali**

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt: Ma hemmx għalfejn tingħata

Proġett ta' akkwist iffinanzjat kompletament jew parzjalment mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): Ie

Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħira u ta' daqs medju (SMEs): Ie

5.1.7. **Akkwist strateġiku**

Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

5.1.9. **Kriterji tal-għażla**

Sors tal-kriterji ta' għażla: Avviż

Kriterju: Referenzi fuq consegne speċifiċi

Deskrizzjoni tal-kriterju ta' selezzjoni: Eignungskriterium ist die Vorlage von 3 Referenzen zu vergleichbaren Installationen. Bei Angeboten für ein Los sind Referenzen für vergleichbare Systeme des jeweiligen Loses vorzulegen. Bei Angeboten für beide Lose können Referenzen für beide Systemtypen oder vergleichbare integrierte Systeme eingereicht werden. Als vergleichbare Referenzen gelten erfolgreich durchgeführte Liefer-, Installations- und Inbetriebnahmeprojekte von Systemen, die in Art, Funktion und Komplexität dem jeweils angebotenen Los entsprechen (Los 1: DualBeam FIB bzw. vergleichbare FIB/SEM-Systeme; Los 2: TEM bzw. vergleichbare Elektronenmikroskope). Die Referenzen müssen den vollständigen Leistungsumfang (Lieferung, Installation, Inbetriebnahme, betriebsbereite Übergabe sowie Einweisung) umfassen und in einem wissenschaftlichen oder industriellen High-Tech-Umfeld erbracht worden sein. Sie dürfen zum Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsfrist nicht älter als drei Jahre sein.

5.1.10. Kriterji tal-għoti

Kriterju:

Tip: Prezz

Isem: Preis (Angebote auf Einzellöse und Kombinationsangebote)

Deskrizzjoni: Für das Zuschlagskriterium Preis erhält das Angebot mit dem niedrigsten (gewerteten) Preis 5 Punkte. Null Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem Doppelten des niedrigsten (gewerteten) Angebotspreises. Alle Angebote mit einem Angebotspreis über dem Doppelten des niedrigsten (gewerteten) Angebotspreises erhalten ebenfalls null Punkte. Die Punktebewertung für die dazwischenliegenden Angebotspreise erfolgt über eine lineare Interpunktion mit 4 Stellen hinter dem Komma.

Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta' ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)

Numru tal-kriterju għall-għoti: 50

Kriterju:

Tip: Kwalità

Isem: Technik (Angebote auf Einzellöse bzw. Kombinationsangebote)

Deskrizzjoni: Für das Zuschlagskriterium Technik werden ausschließlich die nachgewiesenen technischen Leistungsparameter von im Dokument 06.Wertungsmatrix Abschnitt 2 (technische Übererfüllung (wertungsrelevant)) des jeweiligen Loses genannten Anforderungen bewertet. Das Zuschlagskriterium Technik wird ermittelt, indem die Wertungspunkte der einzelnen Anforderungen jeweils mit dem festgelegten Gewichtungsfaktor gemäß Dokument "06. Wertungsmatrix", Abschnitt 2 ("technische Übererfüllung (wertungsrelevant)") des jeweiligen Loses, multipliziert und anschließend aufsummiert werden. Die technische Bewertung eines Kombinationsangebotes setzt sich aus der technischen Bewertung der beiden Einzellöse sowie der Bewertung des zusätzlichen wissenschaftlichen und funktionalen Mehrwerts der gemeinsamen Präparations- und Analytikplattform zusammen. Unterkriterien für diesen Mehrwert sind: K1 durchgängiger Probenworkflow zwischen FIB und TEM K2 Qualität des Probentransfers K3 korrelative Wiederauffindbarkeit identischer Probenbereiche K4 gemeinsames Daten- und Projektmanagement K5 gemeinsames Service- und Betriebskonzept Ergänzend wird auf das Dokument "Gesamt.06.Wertungsmatrix.pdf."

Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta' ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)

Numru tal-kriterju għall-għoti: 50

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż

Skadenza biex tintalab informazzjoni addizzjonali: 10/08/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant, Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Indirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY/documents>

Mezz ta' komunikazzjoni ad hoc:

URL: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY>

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Indirizz għas-sottomissjoni: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-partecipazzjoni: Ġermaniż

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Permissa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 17/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqt li l-offerta għandha tibqa' valida: 77 Jiem

Informazzjoni li tista' tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni:

Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, id-dokumenti kollha neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu pprezentati aktar tard.

Informazzjoni addizzjonali: Die Vergabestelle behält sich vor, fehlende Angaben und Erklärungen nachzufordern. Ein Anspruch der Bieter besteht nicht (§ 56 VgV). Angebote, die nicht die geforderten oder gegebenenfalls nachgeforderten Erklärungen und Nachweise enthalten, werden nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 VgV ausgeschlossen.

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjiegi protetti: Le

Fatturazzjoni elettronika: Permissa

Se tintuża l-ordni elettronika: Ie

Se jintuża l-pagament elettroniku: Ie

5.1.15. Tekniki

Ftehim qafas:

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: Vergabekammer Rheinland-Pfalz, c/o Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima

Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Die Vergabekammer leitet ein

Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. Der Antrag ist unzulässig, soweit - der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberührt, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den

Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt. Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-partecipazzjoni: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH

8. Organizzazzjonijiet

8.1. ORG-0001

Isem uffiċjali: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH
Numru tar-reġistrazzjoni: UStID DE148647541
Indirizz postali: Trippstadter Straße 120
Belt: Kaiserslautern
Kodiċi postali: 67663
Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: wahl@ifos.uni-kl.de
Telefown: +49 631205730
Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:
Xerrej
Organizzazzjoni li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċedura tal-akkwist
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-partecipazzjoni

8.1. ORG-0002

Isem uffiċjali: eureos gmbh steuerberatungsgesellschaft rechtsanwaltsgesellschaft
Numru tar-reġistrazzjoni: UStID DE267215971
Indirizz postali: Kramergasse 4
Belt: Dresden
Kodiċi postali: 01067
Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: l.moerchen@eureos.de
Telefown: +49 39156286912
Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:
Fornitur ta' servizzi tal-akkwist

8.1. ORG-0003

Isem uffiċjali: Vergabekammer Rheinland-Pfalz, c/o Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima
Numru tar-reġistrazzjoni: 07-0001801100000-05
Indirizz postali: Stiftsstraße 9
Belt: Mainz
Kodiċi postali: 55116
Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Mainz, Kreisfreie Stadt (DEB35)
Pajjiż: Il-Ġermanja
Email: vergabekammer.rlp@mwvlw.rlp.de

Telefown: +49 6131162234

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Organizzazzjoni tar-rieżami

8.1. **ORG-0004**

Isem uffiċjali: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Numru tar-registrazzjoni: 0204:994-DOEVD-83

Belt: Bonn

Kodiċi postali: 53119

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Pajjiż: Il-Ġermanja

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefown: +49228996100

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

TED eSender

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: c6abad07-e17d-4e42-b1fc-35d01bf3fcf6 - 01

Tip ta' formola: Kompetizzjoni

Tip ta' avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Sottotip tal-avviż: 16

Data ta' meta ntbagħat l-avviż: 15/07/2026 17:22:32 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant,
Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Ġermaniż

Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 497413-2026

Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 136/2026

Data tal-pubblikazzjoni: 17/07/2026